
СОДЕРЖАНИЕ

ПРИБОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕТОДИКИ

Применение оптических энкодеров в микросканерах СЗМ с большим диапазоном сканирования <i>А. О. Голубок, О. М. Горбенко, А. В. Дворецких, В. В. Котов, И. Д. Сапожников, М. Л. Фельштейн</i>	3
Теория и практика квазиконических энергоанализаторов <i>Ю. К. Голиков, Н. А. Холин, Т. А. Шорина</i>	13
От квазиконических энергоанализаторов к сфероидальным <i>Н. А. Холин, Т. А. Шорина, Д. Кубрик</i>	25
О новых возможностях метода эллипсометрии, обусловленных "нулевой" оптической схемой. Эллипсометрия реальных поверхностных структур. 15. Метрология "нулевой" эллипсометрии. Фактор оптической юстировки фазового компенсатора <i>А. И. Семенов, И. А. Семенов</i>	34
Спектрофотометрический детектор для приборов капиллярного электрофореза <i>Ю. В. Белов, В. Е. Курочкин, В. Л. Суханов</i>	47
Исследование пористых стекол методами конфокальной лазерной сканирующей микроскопии и оптической микроскопии ближнего поля <i>А. А. Евстратов, Н. А. Есикова, М. В. Клоков, И. В. Кухтевич, Т. В. Антропова</i>	52
Вольтамперометрия переменного тока как способ повышения чувствительности определения ионов тяжелых металлов методом инверсионной вольтамперометрии, не требующей концентрационной градуировки <i>Ю. В. Цапко, А. А. Шеремет, С. С. Ермаков</i>	66
Чувствительные элементы датчиков на дисперсионных линиях задержки <i>С. В. Богословский</i>	70

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Населенность спиновых частиц в магнитных ловушках <i>В. И. Ежов, В. Н. Трифанов, М. М. Нестеров</i>	76
К вопросу о радиационном давлении в поле плоской бегущей волны в идеальной жидкости <i>Б. П. Шарфарец</i>	80
О вычислении амплитуды рассеяния включения в сложном поле <i>Б. П. Шарфарец</i>	85
Методы и алгоритмы разделения смеси сигналов. I. Применение декорреляции и статистик второго порядка <i>А. В. Меркушева, Г. Ф. Малыгина</i>	90